



Special lecture on

“高分解能放射光X線イメージング技術の現状と今後”

上杉健太郎 博士
高輝度光科学研究センター

Date: 2017年9月28日 木曜日

Time: 13:30 - 14:30

Room: R3棟 1F 会議室

Abstract:

X線を材料観察に使う最大の理由はその透過力であろう。最近のX線顕微鏡技術の発展により、数十ミクロンからミリメートルの試料サイズの3次元内部情報をサブミクロンスケールで取得出来るようになった。いくつかの放射光施設ではX線CT計測において100nmの空間分解能を達成することも珍しくない。温度や圧力を変化させるその場観察も行われる様になってきた。本講演では大型放射光施設SPring-8における装置開発や利用研究の現状を示すと共に、今後どのような利用研究が可能となるかを示す。

Contact: Nori Nishiyama (Wakai-Nishiyama Lab.)

email, nishiyama.n.ae@m.titech.ac.jp; tel, 045-924-5337